

低エネルギー電子線の線量評価と表面殺菌 — $D\mu$ 値による吸収線量評価とコショウの表面殺菌—

技術の特徴

- 低エネルギー電子線(<300 keV)照射用の線量計システム
- $D\mu$ (表面吸収線量)を推定するためのDepth-doseプロファイル
- 80~250 keV電子線照射による胞子不活性化
- 低エネルギー電子線による乾燥食品の表面殺菌

研究の内容

アラニン線量計(厚さ約100 μm)では低エネルギー電子線の正確な線量評価が困難(図1)。そのため、ラジオクロミックフィルム(厚さ約10 μm)を用いてDepth-doseプロファイルを作成(図2)。

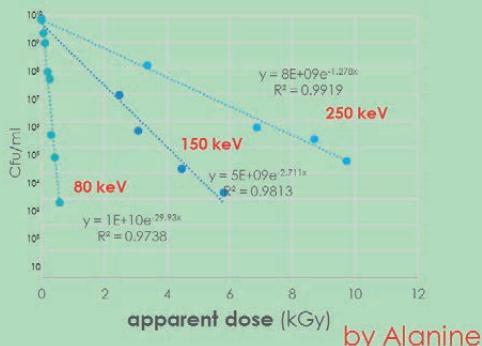


図1. アラニン線量計で測定した低エネルギー電子線の吸収線量と胞子死滅率

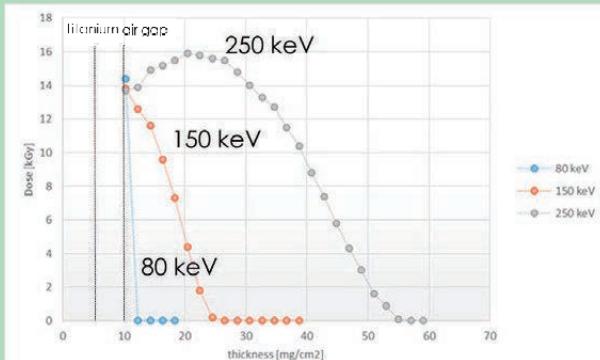
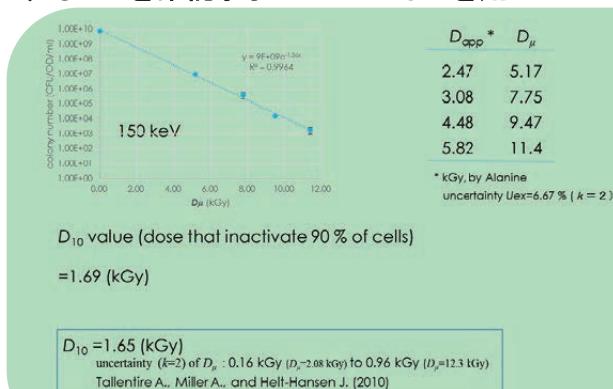


図2. 積層したラジオクロミックフィルム(B3)を用いて計測した低エネルギー電子線のdepth-dose(深度一線量)曲線

Depth-doseプロファイルから $D\mu$ (表面吸収線量)を推定し既報の D_{10} 値と比較(図3)。両者が一致することを確認。オールスパイスを用いて300 keV電子線の殺菌効果を検証した(表1)。



D_{app} *	$D\mu$
2.47	5.17
3.08	7.75
4.48	9.47
5.82	11.4

* kGy, by Alanine
uncertainty Uex=6.67 % (k = 2)

生菌数(CFU/g)

照射なし 7.9×10^5
照射後 $<0.5 \times 10^2$



	%
Bacillus subtilis	91.6
Bacillus mojavensis	5.0
Bacillus endophyticus	1.7
Bacillus vallismortis	1.7

表1. オールスパイスの菌叢解析(MALDIバイオタイピング)

図3. Depth-doseプロファイルからの $D\mu$ (表面吸収線量)推定

今後の展開 低エネルギー電子線照射による脂質の酸化と分解の評価

参 考 ISO/ASTM51818, Practice for dosimetry in an electron beam facility for radiation processing at energy between 80 and 300 keV

共同研究者等 等々力節子、亀谷宏美、Urszula GRYCZKA、IAEA-CRP D61024



農研機構
食品研究部門

〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12

代表研究者: 木村 啓太郎
所 属: 食品生物機能開発研究領域
微生物機能ユニット